

Československá spektroskopická společnost

Bulletin

Čs. spektroskopická společnost
při ČSAV
160 00 PRAHA 6, Kozlovská 1

61
1990

B u l l e t i n
Čs.spektroskopické společnosti

Číslo 61

listopad 1990

Obsah

SEKCE OPTICKÉ ATOMOVÉ SPEKTROSKOPIE

Seminář GDOS (10.-13.9.1990)	6
X.jubilejní seminář o atomové spektrochemii (24.-28.9.1990)	7
Seminář Nové směry v AAS s elektrotermickou atomizací (24.-27.9.1990)	9
Kurs atomové absorpční spektrometrie II.běh (26.-30.11.1990)	10

SEKCE MOLEKULOVÉ SPEKTROSKOPIE

OS spektroskopie pevného stavu	
-optické metody studia dynamiky elektron-děrové plazmy ve výkonových polovodičových strukturách	11
-vibrační spektra supermížek	11
OS magnetické rezonanční spektroskopie	
6.NMR Valtice 1990 a 38.pracovní schůze OS (15.-17.10.1990)	11

SEKCE SPECIÁLNÍCH SPEKTROSKOPICKÝCH METOD

OS hmotnostní spektrometrie	
3.škola hmotnostní spektrometrie (24.-28.9.1990)	13
OS rentgenové spektrometrie	
seminář Novinky na našich pracovištích (24.-27.9.1990)	13
OS elektronové a iontové spektroskopie	
seminář Zpracování dat v elektronových spektroskopických a elektronové mikroskopii (6.11.1990)	14
OS instrumentálních radioanalytických metod	
seminář OS (28.11.1990)	14
OS lokální elektronové mikroanalýzy	
podzimní škola Fyzikální interakce v elektronové mikroskopii a mikroanalýze (15.-19.10.1990)	16

KOMISE

Komise pro standardy a referenční materiály	
18.schůze (2.10.1990)	17
Přístrojová komise	
Nabídka generální opravy atomizátoru WETA 82	17

REFERÁTY

Jan Vobecký : Optické metody studia dynamiky elektron-děrové plazmy ve výkonových polovodičových strukturách	18
Jan Mráz : Akreditace laboratoří	23
Eduard Plško : XI.CANAS - Moskva 1990	25
Zdeněk Slovák: 20 let komerčních zařízení pro AAS s elektrotermickou atomizací v grafitových kyvetách	27

BULLETIN OF THE CZECHOSLOVAK SPECTROSCOPIC SOCIETY, No. 61/1990

Briefly from the content

SOCIETY ACTIVITIES

OPTICAL ATOMIC SPECTROSCOPY

GDOS SEMINAR

Seminar on Glow Discharge Optical Spectroscopy, 10.-13.9.1990,
62 participant, 14 lectures; guest: Prof.Dr.M.Dogan, Kayseri
University/Turkey; 5 representatives from LECO Instrumente and
John Yvon (page 6)

10th ANNIVERSARY SEMINAR ON SPECTROCHEMISTRY
dedicated to the 60th birthday of Prof.M.Matherny (see Bull.
No. 60/1990, p.6) has been attended by many foreign spectro-
scopists among them Prof.K.Zimmer, ELTE Budapest and Prof.
E.Gegus, Veszprém University (page 7)

SEMINAR NEW TRENDS IN AAS WITH ELECTROTHERMAL ATOMIZATION
24.-27.9.1990, 93 participants, 17 lectures on the theory of
AAS ETA processes, background correction, platform and probe
techniques, software used for signal processing and practical
applications of ETA (page 9)

COURSE OF LECTURES ON AAS
a popular course on AAS (see Bull. No. 60/1990, p.13) has been repeated 26.-30.11.1990. It was attended by 57 young spectroscopists. (page 10)

MOLECULAR SPECTROSCOPY

SOLID STATE SPECTROSCOPY GROUP
organized meetings with the lectures on optical methods used
in the study of electron gap plasma dynamics in semiconductor
structures and on the vibration spectra of super-lattices (see
the contribution by Jan Vobecký presented on p.18)

THE 6th NMR SEMINAR VALTICE 1990
including 26 lectures was organized by MAGNETIC RESONANCE
SPECTROSCOPY GROUP from 15. to 17.10.1990 together with the
38th group session. (page 11)

SPECIAL SPECTROSCOPIC METHODS

THE 3rd MASS SPECTROSCOPY SCHOOL attended by 47 spectroscopists was organized by MS GROUP within 24.-28.9.1990. This time, the programme consisting of 24 lectures and short communications had been enriched by contributions of 8 foreign guests from several European universities.

X-RAY SPECTROMETRY GROUP

ELECTRON AND ION SPECTROSCOPY GROUP

organized a seminar on DATA PROCESSING IN ELECTRON SPECTROSCOPY
AND MICROSCOPY on 6th November 1990
(10 lectures, 27 participants) (page 14)

INSTRUMENTAL RADIOANALYTICAL METHODS GROUP

met at a one-day seminar on NAA and PIXE techniques covered by
3 lectures (page 14)

ELECTRON-PROBE MICROANALYSIS GROUP

prepared a seminar for 73 participants in a beautiful mountain
centre of High Tatras (page 16)

COMMISSION**FOR STANDARDS AND REFERENCE MATERIALS**

gathered on 2.10.1990 for their 18th session (page 17)

COMMUNICATIONS

Jan Vobecký: OPTICAL METHODS USED FOR THE DYNAMICS STUDY OF
THE ELECTRON GAP PLASMA IN THE STRUCTURE OF POWER SEMICON-
DUCTORS (page 18)

Jan Mráz : AUTHORIZATION OF ANALYTICAL LABORATORIES (continu-
ation of the subject discussed in the last issue) (page 23)

Eduard Plško : X .CANAS - MOSCOW 1990 (page 25)

Zdeněk Slovák : 20 YEARS OF THE COMMERCIAL EQUIPMENT TO THE
AAS WITH ELECTROTHERMAL ATOMIZATION IN THE GRAPHITE TUBE
(page 27)

GLOSSARY OF ABBREVIATIONS AND ACRONYMS (page 28)
INFORMATION (page 35)

8th Int. Conf on Fourier Transform Spectroscopy

Texts concerning standardization procedure are available on
floppy discs at UTRIN

Representation of firms RAITH and GETAC

REPRESENTATION OF NEW EXCHANGES OF INFORMATION ON THE
INTERNATIONAL MARKET OF ANALYTICAL EQUIPMENT
(11 pages)

WELCOME :

to the NEW FOREIGN MEMBERS of our Society
accepted during the 4th quarter of 1990 :

Peter Alan BATES

UNIEXPORT Instr., Ltd, Buckinghamshire

Ivor DOMINAK

NICOLET Instr., G.m.b.H., Offenbach

Hans Jürgen FIEDLER

GETAC Instr., G.m.b.H., Mainz

John B. HOOPER

GALILEO ELECTRO-OPTIC Corp., Brussels

S. MÜLLER

SPECTRONEX AG, Bassel

Franz George REISINGER

PERKIN-ELMER, G.m.b.H., Wien

Jiří HRDLIČKA

PHILIPS SCIENTIFIC/TRADEX, Cambridge/Prague

SEKCE OPTICKÉ ATOMOVÉ SPEKTROSKOPIE

SEMINÁŘ GDOS

proběhl ve dnech 10. - 13.9.1990 v Klubu pracujících v Rokycanech za účasti 62 tuzemských a 6 zahraničních účastníků (3 zástupci fy LECO Instrumente, 2 zástupci fy Jobin Yvon, prof.dr. M.Dogan - Universita Kayseri, Turecko). V rámci semináře bylo předneseno celkem 14 referátů k následujícím tématickým celkům :

- fyzikální principy GD-spektrometrie
- postavení GDOS v analytice
- současný stav instrumentace GDOS
- aplikace GDOS pro objemovou analýzu
- aplikace GDOS pro analýzu povrchů
- referenční materiály pro GDOS.

Součástí programu byla rovněž rozsáhlá diskuse a praktická demonstrace nové přístrojové techniky v ÚVZÚ ŠKODA Plzeň. Seminář potvrdil velmi perspektivní postavení GDOS mezi současnými spektrometrickými technikami. Host ČSSS a ČSVTS, prof.dr.M.Dogan (Universita v Kayseri, Turecko) přednesl v rámci semináře 2 významné referáty.

Dále uvádíme přehled hlavních přednášek :

- Dr.Čížek (Škoda Plzeň) : GDS vs. Analytik
- Dr.Weiss (Škoda Plzeň) : GD-physikalische Grundlage
- Prof.Dogan (Kayseri University) : Investigation of GDL for spectrochemical analysis
- Dr.Krahl (fa LECO) : GDS-Systeme für die Routineanalytik in der metallverarb. Industrie; technische Konzeption der LECO GDS-Systeme
- Dr.Krahl (fa LECO) : Vergleich GDS-Funken-RFA-ICP
- Ing.Hunoult (fa Jobin-Yvon) : Jobin-Yvon GDS-Systeme
- Prof.Dogan (Kayseri University) : Comparison of commercial GDL with magnet field GDL in their spectrochemical properties
- Dr.Krahl (fa LECO) : Beispiele aus der Bulk-Analytik
- Ing.Čechura (Škoda Plzeň) : Die Erfahrungen mit Bulk-Analytik in ŠKODA
- Dr.Krahl (fa LECO) : Beispiele aus der Oberflächenanalytik für die Routine und Spezialanalytik
- Dr.Förster (fa LECO) : Quantifizierung von C und N Bestimmung in Tiefenprofilanalysen von Stahl

Dr.Weiss (Škoda Plzeň) : Beispiele u. Erfahrungen aus der Oberflächenanalytik in ŠKODA
 Ing.Bičovský (ČKD Praha) : SRM für GDS
 Dr.Klapka (SVÚOM Praha) : SRM für Tiefenprofilanalyse

Ing.Zdeněk Čížek, CSC

X.JUBILEJNÍ SEMINÁŘ O ATOMOVÉ SPEKTROCHEMII

pořádaný Slovenskou chemickou společností při SAV, katedrou chemie hutnické fakulty VŠT v Košicích a Č.spektroskopickou společností se konal ve Staré Lesné ve dnech 24. - 28.9.1990. Jeho slavnostní jubilejný ráz byl zdůrazněn okolností, že se konal u příležitosti životního jubilea prof.Ing.Mikuláše Mathernyho, DrSc (viz Bulletin 60/1990, str. 6). Význam jubilantovy práce vědecké i pedagogické byl v úvodu semináře vyzdvižen v přednáškách prof.K.Zimmera z ELTE-Budapešť "Gemeinsame spektrochemische Untersuchungen in dem Lehrstuhl für Chemie der HF-VŠT, Košice und dem Institut für anorganische und analytische Chemie der ELTE, Budapest zwischen 1970 - 1990", prof.E.Geguse z university ve Veszprému "Richtlinien und wissenschaftlichen Verbindungen der spektrochemischen Analysentätigkeit an der Veszprém Universität, mit besonderem Hinsicht an dem Lehrstuhl für Chemie der HF-VŠT Košice" a Dr.Ž.Rybárové "Košická spektroskopická škola Prof.Mathernyho". Program semináře byl velmi bohatý, a to i na aktivní účast významných zahraničních odborníků, jak ostatně vyplývá i z následujícího přehledu přednášek :

- H.Nickel : Einsatz der induktiv gekoppelten Plasma-Emissionspektrometrie zur Analyse pulverformiger keramischer Werkstoffe
- K.Danzer, D.Wienke, M.Wagner : Signal Processing in Atomic Spectrography - Present Realities and Limits
- B.V.Pavlović, M.Marinković : Investigation of plasma parameters in the U-shaped DCP spectroscopic source
- E.Plško : Využitie výpočtovej techniky pri spracovaní atomových spektier
- Gy.Heltai, K.Zimmer, K.Flórián : The Influence of Background Intensity on the Spectrographic Calibration
- K.Eckschlager : Vliv kalibrace na informačný zisk výsledku spektrochemických analýz
- Gy.Záray, B.Derecskei, I.Varga, T.Kántor : Analyse von Al_2O_3 und Si_3N_4 -Pulver mittels ICP-AES Methoden
- K.Niebergall, K.Dittrich : Trace Analysis by ETV-ICP-AES
- K.Dittrich : One-and Two-Step Procedures in Atomic Emission Spectrometry for Trace Analysis
- M.Matherny : Postavenie emisnej a absorpcnej atómovej spektrochémie na Slovensku
- A.Gogala : Quality Assurance of the Optical Emission Spectrometric System with Statistical Methods
- J.Einax : Chemometrische Untersuchungen umweltanalytischer Ergebnisse von Staubniederschlägen

- J.Tóth : Emission Analysis of Steels Using Gasstabilized Micro-Spark Method in Different streaming Gas Atmospheres
- J.Kopecký, M.Bernas, J.Hozman, P.Türk, M.Vlasák, H.Prokopová : Metrologické charakteristiky vyhodnocení spektrální desky polovodičovým snímačem obrazu (CCD)
- J.Toman, V.Streško, J.Kubová : ICP-OES with ETV Sample Introduction
- J.Kubová, J.Polakovičová, J.Medveď : Problémy stanovenia Nb a Ta metódami atómovej emisnej spektroskopie
- V.Streško, M.Veber, S.Gomišček : Využitie ON-LINE prekoncentrácie v atómovej spektroskopii na stanovenie stopových prvkov vo vodách
- E.Martiny, J.Medveď : Spektroskopické stanovenie stopových prvkov v apatitech
- M.Fišera, Z.Hladký, J.Ríšová : Způsoby eliminace matrice pri stanovení abiogenných prvků metodou AAS
- G.Holécziová : Sledovanie koncentrácií kovových prvkov v pitných vodách v okolí Košíc
- S.Krištoufková : Využití spektrálních metod při analýze půd
- E.Reitznerová, K.Flórián : Hodnotenie výkonnosti prístrojov Perkin-Elmer 2380 a AAS 1 N na základe informačných charakteristik
- M.Valigová : Stanovenie vzácných zemín v geologických materiáloch metodou OES
- B.Welz, M.Sperling, X.Yin : Flow Injection On-line Separation and Preconcentration for Graphite Furnace AAS
- N.P.Staršinova, G.I.Tsynin, G.P.Pantelejev, E.M.Sedych, A.A.Formanovsky : Determination of Microelements in Natural Waters by ICP-AES Technique after their Sorbtion Preconcentration
- M.Pisárik : Využitie Fourierovej transformácie v optickej spektroskopii
- T.Gál, L.Morvay, I.Cornides : Hmotnostno-spektrometrické vyšetrovanie karbidových iónov v plazme
- R.Szücs, J.Ríšová, Z.Hladký : Vplyv porovnávajúceho prvku na správnosť analytického výsledku v sekvenčnej ICP-OES
- N.Pliešovská, Ž.Rybárová, J.Šesták : Sledovanie obsahu ľahkých kovov v sedimentoch vodných nádrží metodou AES
- E.Krakovská : Elektrotermische Atomisierung aus der Wolframoberfläche
- L.Koller : Vplyv koncentrácie KCl na radikálne rozloženie excitácej teploty v plazmovom zdroji podla Marinkovića
- E.Terpáková, K.Flórián : Optimalizácia spektrografického stanovenia vybraných PVZ
- N.Pliešovská, G.Sučík, P.Šoltéz : Porovnanie fotografickej a fotoelektrickej detektie signálu pri stanovení PVZ metodou ICP-AES
- K.Flórián : Chemometria v atómovej spektrochémii : Ciele a príklady použitia

K úspěšnému průběhu semináře přispěl i společenský večer, uspořádaný s přispěním firmy Perkin-Elmer.

SEMINÁŘ NOVÉ SMĚRY V AAS S ELEKTROTERMICKOU ATOMIZACÍ

se konal v rekreačním středisku Jitex ve Štědroníně ve dnech 24. - 27.9.1990. Přes své užší zaměření, pro které pořadatele předpokládali maximální počet účastníků ne více než 60, dosáhl konečný počet účastníků počtu 93, což prakticky vyčerpalo možnou ubytovací kapacitu.

Seminář byl zaměřen na poznatky posledních let v obořu atomové absorpcní spektrometrie s elektrotermickou atomizací.

V přehledných referátech byly uvedeny poznatky z oblasti teorie, jako je popis atomizačních procesů v ETA, popis signálů a problematika izotermické atomizace s praktickými důsledky. Novinky v přístrojové technice se týkaly hlavně kovových atomizátorů (autoři z VŠCHT Praha), korekce pozadí, atomizace ze sondy a vývoje nového software pro přístroj Varian 775 (autoři z VÚHÚ Most). Tato přednáška byla spojena s demonstrací a bohatou diskusí, jíž byl věnován jeden večer.

Dále bylo předneseno několik referátů z praktických aplikací na konkrétní materiály a přehledný referát o modifikátorech osnovy vzorků k odstranění rušivých vlivů a stability analytů v ETA. Každý referát byl doplněn diskusí, které se zúčastňovali i začínající pracovníci v AAS.

Zhodnocení semináře provedl RNDr.Josef Musil, vedoucí atomové sekce, který zdůraznil, že bohaté diskuse svědčily o tom, že i mladší kolegové mají řadu zkušeností, o nichž by měli na semináři tohoto typu referovat. Současně ocenil práci organizátorů, kteří pracovali pod vedením Dr.Jiřiny Korečkové, CSc.

Dále uvádíme přehled referátů, z něhož je zřejmý profil specializovaného semináře.

- J.Korečková : Pokroky v atomizačních procesech
- J.Dědina : Dvoustupňový atomizátor
- J.Musil : Tvar signálu v AAS s ETA
- Z.Slovák : Dávkování suspenzí do ETA
- I.Novotný, J.Komárek : Elektrotermická atomizace ze sondy
- L.Parolková, Z.Slovák : Výhody stopové analýzy s přímým dávkováním pevných sorbentů do grafitového atomizátoru
- J.Komárek : Modifikátory při ETA
- J.Mareček, V.Synek : Interference fosforečnanů při stanovení těkavých prvků ET-AAS
- V.Sychra, R.Hlaváč : Alternativní atomizátory ke grafitovým ETA
- J.Doležal : Wolframový elektrotermický atomizátor WETA 88
- G.Sučík : Rozšíření pracovních možností wolframového atomizátoru WETA 82
- O.Vyskočilová : Analytické možnosti atomizátoru WETA 88
- L.Filková : Kovy v životním prostředí
- K.Kult, M.Skalický : Optimalizace stanovení kadmia v jahodových kompotech elektrotermickou atomizací se Zeemanovou korekcí pozadí
- P.Püschel : Integrovaný uživatelský software
- V.Spěváčková, M.Cejchanová : Stanovení nečistot v oxidu europia
- B.Dočekal : Korekce pozadí v AAS

KURS ATOMOVÉ ABSORPČNÍ SPEKTROMETRIE - II.běh

se uskutečnil v Janově n. Nisou ve dnech 26. - 30.11.1990 a zúčastnilo se jej 57 frekventantů. Obdobně jako první běh kurzu (viz Bulletin 60/1990, str. 13) byl i druhý běh navštíven převážně mladými pracovníky v oboru AAS a tentokráté dokonce i dvěma studenty 4. ročníku analytické chemie, jimž účast umožnila přírodovedecká fakulta UK. Účastníci kurzu ocenili i možnost vzájemného poznání pracovních problematik, k čemuž byla dána příležitost při diskusích.

Frekventantům kurzu bylo vydáno osvědčení o absolvování.

SEKCE MOLEKULOVÉ SPEKTROSKOPIE

OS SPEKTROSKOPTE PEVNÉHO STAVU

uspořádala pro své členy a další zájemce dvě přednáškové akce s diskusí. Prvá se konala dne 26.9.1990 a byla věnována tématu Optické metody studia dynamiky elektron-děrové plazmy ve výkonových polovodičových strukturách, druhá, zaměřená na vibrační spektra supermřížek (fonony v supermřížkách a Ramanova spektroskopie), se uskutečnila dne 11.12.1990. Obě akce řídil vedoucí OS Dr. Jan Polecha, CSc., na jehož doporučení přinášíme výtah z přednášky k prvnímu tématu autora Jana Vobeckého v části Referaty (str. 18).

OS MAGNETICKÉ REZONANČNÍ SPEKTROSKOPIE

uspořádala ve dnech 15. - 17.10.1990 seminář 6.NMR VALTICE 1990 a v jeho rámci pro své členy 38.pracovní schůzi, na níž přítomní byli seznámeni s konáním NMR konference československo-maďarsko-italské v Balatonszemes, Maďarsko, 18. - 20.10.1990. Z ČSFR se účastní asi 15 členů OS. Podobné konference se mají opakovat vždy po dvou letech. Je zájem rozšířit je na země Pentagonály, tj. přibrat Rakousko a Jugoslávii. Našim delegátům bylo doporučeno, zajímat se uspořádání konference v ČSFR v roce 1994.

Dále byla na příští rok schválena národní konference ve Valticích (červen nebo květen) a o připravovaném výrobním programu Tesly Brno v oblasti NMR spektrometrů informoval zástupce Tesly Ing.V.Zeman. Na závěr schůze informoval o výrobním programu italské firmy Stelar Ing.S.Sýkora.

Z programu 6.NMR VALTICE 1990 dále uvádíme alespoň přehled hlavních referátů :

V. Sklenář : NMR spektroskopie ve více dimenzích

L.Půček, V.Sklenář : Využití selektivní excitace ve vícedimenzi-
zionální NMR spektroskopii

P.Kessler, V.Sklenář : Simulace vícedimenzionálních NMR spekter

Z. Starčuk, K. Bartušek, Z. Starčuk, Jr. : NMR mikroskopie
K. Bartušek, Z. Starčuk, Z. Starčuk, Jr. : Analýza

K.Bartušek, Z.Starčuk, Jr., Z.Starčuk : Aplikace gradientních pulsů v NMR mikrotomografii

Z.Starčuk, Jr. : Koherenční stezky v lokalizačních experimentech
 J.Halámk : Koncepce řízení experimentu
 P.Jurák : Deformace spektrálních čar v nehomogenním magnetickém poli
 M.Kasal : Přístrojové problémy selektivní excitace AM pulsy.
 V.Formáček : NMR spektrometry firmy Bruker
 P.Dvortsak : Inversní měřící metody na spektrometrech Bruker
 V.Mlynárik, M.Mazúr, P.Pelikán : Výpočet rychlostních konstant hydrolyzy a polykondenzácie TMOS a TEOS
 M.Nechvátal, M.Holík, J.Halámk : Výpočet komplexačních konstant s posuvovými činidly
 E.Solčáňová, V.Sutoris : Tautoméria derivátov kyseliny malónovej
 P.Sedméra, K.Čapek, E.Čádová : NMR studium anhydroderivátů sacharosy
 J.Pelnář : Koncepce nové centrální NMR laboratoře ÚOCHB ČSAV a nový výrobní program firmy Varian (řada UNITY a GEMINI)
 M.Macháček, V.Bočková : Stanovení léčiv v lékových formách NMR spektroskopí
 R.Hrabal, P.Kočiš : Konformační analýza krátkých lineárních peptidů pomocí NMR
 T.Liptaj, D.Uhrín : Selektívne metódy NMR
 S.Uhrínová, D.Uhrín, E.Petráková, J.Ruppeldt : Priradovanie ^{13}C rezonancií karbonylových uhlíkov v acetylovaných sacharidoch pomocou 2D NMR
 J.Bella, T.Liptaj, J.Dressler : Zapojenie pre experimenty so selektívnymi protónovými impulzami na spektrometrii VXR
 M.Hájek : Co je a co není klinická aplikace MR spektroskopie
 D.Kůrková, A.Horská, M.Hájek : Praktické porovnání lokalizačních technik měření ^{31}P NMR spekter lýtka vých svalů
 A.Horská, J.Tintěra, J.Vítkovec, M.Hájek : ^{31}P NMR spektroskopie myokardu
 J.Tintěra : Použití "steady state" sekvencí pro MR zobrazování
 J.Tintěra, J.Prádný, M.Hájek : Porovnání ^1H a ^{31}P NMR spekter získaných na dvou typech celotělových magnetů (Magnetom, Helicon)

SEKCE SPECIÁLNÍCH SPEKTROSKOPICKÝCH METOD

OS HMOTNOSTNÍ SPEKTROMETRIE

realizovala v Klučenicích ve dnech 24.-28.9.1990 již 3. školu hmotnostní spektrometrie, jíž se zúčastnilo 47 účastníků, z toho 8 pozvaných hostů - profesorů z evropských universit a z Akademie věd NDR. Celkem bylo předneseno 24 přednášek, z toho 15 hodinových zabývajících se nejnovějšími úspěchy hmotnostní spektrometrie. Druhá část školy byla naplněna krátkými sděleními převážně mladých čs. odborníků. Všechny přednášky byly doprovázeny bohatou diskusí, všechny byly předneseny anglicky, angličtina byla jedinou jednací řečí školy. Především první část školy měla velmi dobrou evropskou úroveň, řada přednášek byla na světové úrovni (např. G.Dube, M.Przybylski, A.P.Bruins, E.Gelpi, K.Varuza, J.D.Erhardt, J.Schmidt, A.Lehmann).

V rámci školy se konala schůze odborné skupiny hmotnostní spektrometrie ČSSS. Byly řešeny otázky charakteru budoucích škol hmotnostní spektrometrie a účasti na 12. mezinárodní konferenci v Amsterdamu v r. 1991.

Pro účastníky školy byl vydán sborník abstraktů přednášek.

RNDr. Miroslav Ryska, CSc, předseda OS

OS RTG SPEKTROMETRIE

usporeádala ve dnech 24.-27.9.1990 ve Fojtce u Liberce seminář "Novinky na našich pracovištích", jehož se zúčastnili 43 specialisté. Úspěšný program semináře, z něhož dále uvádíme přehled referátů, vedl členy OS k dohodě, že podobné semináře budou pořádat každé 2 roky. Po stránce odborné připravil seminář Dr.V.Macháček, po stránce organizační Ing.R.Výmola.

Program semináře :

V.Buzek : ED analyzátor Link MECA 10-44 a jeho využití
 J.Dědeček, M.Černý : Rentgenový fluor.spektrometr Philips PV 9550 (EDS)

J.Balcárek : Analýza anorganických pigmentů

R.Výmola : Stanovení kovů v koncentrátech

V.Helán, K.Kořínek, K.Merta, E.Sváty, B.Švardalová : Využití a zkušenosti rentgenové spektrometrie v laboratořích hutních podniků

V.Macháček : Stanovení vzácných zemin

A.Šolcová : Stanovení obecných kovů v matrici stěrů drahých kovů

V.Budil : Rentgenfluorescenční stanovení cíno-wolframových rud

K.Walder : Stanovení fosforu v uhlí ED-RFA

Z.Houdková : Analýza popelů

OS ELEKTRONOVÉ A IONTOVÉ SPEKTROSKOPIE

zorganizovala pro své členy a další zájemce dne 6.11.1990 v ÚFCHE JH v Praze celodenní seminář na téma "Zpracování dat v elektronových spektroskopických a elektronové mikroskopii".

Seminář organizoval RNDr.Vladimír Anděra, CSc.

Účastníci semináře (celkem 27) byli seznámeni s teoretickými základy oboru a s vybranými způsoby zpracování experimentálních dat v elektronových spektroskopických a elektronové mikroskopii prostřednictvím přednášek :

RNDr.Z.Hájek : Využití teorie informace při zpracování experimentálních dat

RNDr.V.Anděra : Fourierova transformace, vyhlažování a dekonvoluce elektronových spekter

RNDr.M.Sobotka : Numerická derivace experimentálních dat

RNDr.J.Zemek : Metoda "Pattern recognition" v Augerově spektroskopii

RNDr.L.Frank : Zpracování obrazových dat v analytické rastrovací elektronové mikroskopii

OS INSTRUMENTÁLNÍCH RADIOANALYTICKÝCH METOD

připravila na 28.11.1990 seminář o NAA a PIXE, který se konal v ÚVVVR v Praze. K předneseným referátům byla diskuse, která v souhrnu potvrdila zlepšování kontaktů se zahraničními laboratořemi radioanalytických metod, což bude nepochyběně přínosem pro naše pracoviště. Poznatky ze zahraničních pobytů, které mají specializovaný charakter, budou předneseny na konferenci IAA 91 v Klučenicích. Diskuse se zaměřila i na některé potíže v uplatňování radicanalytických metod v praxi, vyplývající z dosud neobjasněných současných ekonomických vztahů.

Dále přinášíme resumé přednesených referátů na semináři.

Vladimír Hnatowicz, Ústav jaderné fyziky ČSAV, Řež:
Analýzy metodou PIXE na Philipps University v Marburgu (SRN)

Během svého čtrnáctidenního pobytu na Philipps Universität v Marburgu (SRN) jsem měl možnost seznámit se detailně s metodikou používanou při analýzách metodami PIXE a RBS na tomto pra-

covišti, které, ale spoluž pokud se jedná o analýzy metodou PIXE, patří mezi nejznámější v SRN. Základním experimentálním zařízením je elektrostatický urychlovač typu VdG s maximální energií urychlených částic 4 MeV, zakoupený v r. 1967 od firmy High Voltage (USA). Pro analýzy metodou PIXE je k dispozici velmi dobré experimentální zařízení umožňující ve zcela automatickém režimu analyzovat 20 vzorků v jedné sekvenci. Zařízení je vybaveno systémem pro pulsaci svažku podstatně omezujícím efekty pile-up. Detekce charakteristického rtg. záření se provádí simultánně dvěma Si(Li) detektory (vysokoenergetická a nízkoenergetická část spektra) a energetická spektra se akumuluje v paměti personálního počítače, který slouží i k řízení experimentu. Vyhodnocení PIXE spekter se provádí na počítači VAX programem SÉSAM.

Skupina není v současné době napojena na žádný větší výzkumný program a rutinní analýzy PIXE se prakticky neprovádějí. Databáze nutné pro kvantitativní vyhodnocení analýz pochází z dřívější doby a nejsou ani obnovovány, ani kontrolovány. S těmito výhradami lze provádět běžné analýzy PIXE na tenkých vzorcích. Během svého pobytu jsem analyzoval cca 30 vzorků čs.aerosolů na nucleoporových a synporových filtroch. Získané výsledky poslouží jako srovnávací materiál pro obdobná měření prováděná v ÚJF. Za svého pobytu v Marburgu jsem se rovněž zabýval analýzami metodou RBS a provedl jsem celou řadu měření hloubkových koncentračních profilů kyslíku v polovodičových materiálech s využitím resonančního rozptylu 3.04 MeV častic alfa.

Ivan Obrusník, Ústav jaderné fyziky ČSAV, Řež :
Zkušenosti z pobytu v Laboratoři neutronové aktivaci analýzy IRI Delft (Nizozemí)

Laboratoř NAA v IRI (Interfaculty Reactor Institute) v Delftu využívá k ozařování vzorků 2 MW výzkumný bazénový reaktor HOR, který patří IRI a pracuje naprostě spolehlivě a pravidelně. K vybavení reaktoru s tokem neutronů $4 \times 10^{12} \text{ cm}^{-2} \text{s}^{-1}$ patří 3 pneumatické pošty běžného typu, 1 rychlá pošta s dobou doletu cca 7 s, 4 suché ozařovací kanály, 1 mokrý kanál pro ozařování velkých vzorků (až několik kg) a konečně i možnost provozu jedné pošty pro aktivace epitermálními neutrony.

Oddělení instrumentální NAA (INAA) má 19 pracovníků, z toho stálých 7, na termínovaných projektech 6, v servisní skupině 3 a hostů 3. K hlavním cílům oddělení patří vývoj nového systému INAA (hardware, software, přechod na nový způsob standardizace s k_0 faktory), metodika ozařování a gamaspektrometrického měření velkých vzorků, budování počítačové sítě (UNIX) pro 6 vzájemně propojených pracovních stanic Apollo a zdokonalení systému zabezpečení jakosti pro rutinní NAA.

Oddělení se zabývá i aplikacemi NAA - především pro analýzu vzorků z životního prostředí (analýza mechů a lišejníků, ptáků, stanovení ^{77m}Se ve všech typech biologických materiálů) i vzorků geologických. Z dalších zajímavostí ve vybavení oddělení lze uvést velký počet gamaspektrometrů s polovodičovými detektory, z toho 3 jsou studnové s velkou účinností měření, nepřetržitý plně automatický provoz všech spektrometrů (měří se 24 hodin denně i přes víkendy s důsledným využitím měničů vzorků). Pracoviště umožnuje žadatelům o analýzy metodou NAA provádět si analýzy vlastními silami po krátkém

zacvičení přímo v IRI. K pracovní pohodě přispívá kromě kvalitního experimentálního vybavení a dostatečného počtu terminálů a osobních počítačů i dobře vedená knihovna a Xerox dostupný každému opět prakticky 24 hodin denně.

Kromě oddělení INAA existuje v IRI i oddělení, které se zabývá metodou NAA s radiochemickou separací. Pro NAA se zde využívají moderní separační postupy včetně speciálních ionexů, metody HPLC atd. Nezapomíná se ani na vybudování "čisté laboratoře" pro stanovování extrémně nízkých koncentrací prvků.

Dalibor Tluchoř, Václav Jiránek, Ústav pro výzkum, výrobu a využití radioisotopů, Praha : Informace o tréninkovém kursu pořádaném firmou SILENA

Jako součást nákupu velkého gama-spektrometrického systému od fy. SILENA absolvovali dva pracovníci z ÚVVVR školení přímo u výrobce v jeho sídle v Miláně.

Protože množství instalovaných systémů firmou SILENA u nás v posledních letech značně vzrůstá a prognóza pro příští rok je v porovnání s konkurenčními firmami pro SILENU i nadále optimistická, rozhodli jsme se seznámit s našimi poznatky z tohoto školení i širší veřejnost uživatelů mnohakanálových spektrometrů.

Firma zaměstnává asi 55 pracovníků v nové, velmi dobré vybavené budově na okraji Milána. Je zaměřena na výrobu přístrojů pro α , β , γ spektrometrii, monitorování životního prostředí, dílů pro RF difraktometry a příslušný software. Ve všech směrech produkce převažuje ideová, koncepcní a montážní práce. Jen menší část činnosti je výrobní. Zbylá větší část výrobního objemu je řešena formou subdodávek u jiných, převážně italských firem.

Zřejmě nejúspěšnějším výrobkem poslední doby je přenosný víceúčelový přístroj SNIP na monitorování aktivity, resp. dávky, umožňující dle svého vybavení spektrometrii záření α , β , γ .

Ve výrobním programu jsou pro γ -spektrometrii zahrnutý prakticky všechny moderní systémy, založené na mnohakanálovém analyzátoru, memory bufferu a sběrné kartě v PC.

Retězce spektrometrické trasy zahrnují moduly pro měření jak nízkých a středních četností, tak i moduly pro měření četnosti do 100 000 imp/s.

OS LOKÁLNÍ ELEKTRONOVÉ MIKROANALÝZY

uspořádala ve dnech 15.-19. října 1990 ve Staré Lesné podzimní školu "Fyzikální interakce v elektronové mikroskopii a mikroanalýze", které se zúčastnilo 80 účastníků.

KOMISE

KOMISE PRO STANDARDY A REFERENČNÍ MATERIÁLY

uspořádala dne 2.10.1990 v Klubu techniků v Praze svoji 18.schůzi.

Na schůzi bylo usneseno, že na podzim bude uspořádána ve spolupráci s Čs.metrologickou společností a pod záštitou čs. výrobčů referenčních materiálů Konference o referenčních materiálech (s mezinárodní účastí).

PŘÍSTROJOVÁ KOMISE

Všem uživatelům WETA 82

Přístrojová komise oznamuje, že Laboratoř AAS CL VŠCHT Praha nabízí majitelům wolframového elektrotermického atomizátoru WETA 82 (výrobce Laboratorní přístroje Praha) provedení generální opravy spojené s kompletní rekonstrukcí řídící elektroniky.

Získáte :

- zvýšenou spolehlivost
- stabilitu nastavených parametrů
- automatickou signalizaci přítomnosti pracovních médií (H_2 , Ar, H_2O) a blokování chodu přístroje při jejich nepřítomnosti
- krátké výřazení přístroje z provozu (max. 1 měsíc)
- jednoroční záruku na provedené práce

Rekonstrukce budou zahájeny v druhém pololetí 1991.

Zájemci budou vyzváni k dodání přístroje v předem dohodnutém termínu. Součástí rekonstrukce je i instalace u zákazníka. Cena celé rekonstrukce je zatím odhadována na 20 000 Kčs.

Zájemci hlaste se na adresu :

Ing.Jiří Doležal, CSc
VŠCHT laboratoř AAS CL
166 28 Praha 6, Technická 5
tel. (02) 3324153, (02) 3323789

Zároveň Vás prosíme o předání této informace těm uživatelům přístroje WETA 82, kteří patří do okruhu Vašich kolegů.

REFERÁTY

Jan Vobecký, katedra mikroelektroniky FEL ČVUT Praha :
Optické metody studia dynamiky elektron-děrové plazmy ve výkonových polovodičových strukturách

Výroba křemíkových výkonových polovodičových struktur (VPS) je v současnosti založena na využití vysoce náročných technologií mikroelektroniky. Vytvářené struktury jsou vysoce členěné ve všech dimenzích. Dosažení požadované úrovně mezních parametrů vyžaduje znalost vnitřního chování struktury v konkrétních podmínkách. Tato znalost je dostupná za předpokladu využití moderních diagnostických metod pro stanovení dynamického rozložení koncentrace nadbytečných elektronů a děr s vysokým prostorovým rozlišením (1, 2).

Jedná se zejména o optické metody založené na
 1) emisi rekombinačního záření ($1,1 \mu\text{m}$), jehož intenzita je
úměrná součinu koncentrací nadbytečných elektronů a děr n.p
 2) absorpci záření ($3,39 \mu\text{m}$) na volných nosičích náboje, kde
je absorpční koeficient úměrný součtu koncentrací n+p.

Metoda 1) využívá detekce spontánně emitovaného záření produkovaného mezipásovou rekombinací za účasti fononu. Tento mechanismus je odpovědný za relativně nízkou citlivost metody. Přestože se jedná o nízkou vlnovou délku ($1,1 \mu\text{m}$), lze jen těžko dosáhnout prostorového rozlišení pod $30 \mu\text{m}$ (prakticky spíše $40 - 50 \mu\text{m}$). Důvodem je všesměrovost emitovaných fotonů ve vzorku a velký poměr indexu lomu křemíku a vzduchu. Další nevýhodou je, že jsou detegovány jen nosiče zúčastněné v mezipásové rekombinaci.

Naproti tomu metoda 2) díky svému principu podává informaci o koncentracích nosičů nezávisle na tom, jakým mechanismem zrekombinují. To vše ale za cenu větší technické náročnosti, neboť vzorek musí mít obnaženy dva planparalelní povrchy. Větší citlivosti bylo dosaženo tím, že se absorpcie měří pomocí soustředěného svazku koherentního záření He-Ne laseru. Ačkoliv je vlnová délka třikrát větší ($3,39 \mu\text{m}$), lze dosáhnout bez nežádoucích kompromisů prostorového rozlišení až $25 \mu\text{m}$. Větší

citlivosti je primárně dosaženo tím, že absorpcie, a tím i měřený signál, je úměrná součtu koncentrací n+p. Časové rozložení obou metod je řádu stovek ns (typicky 400-600 ns).

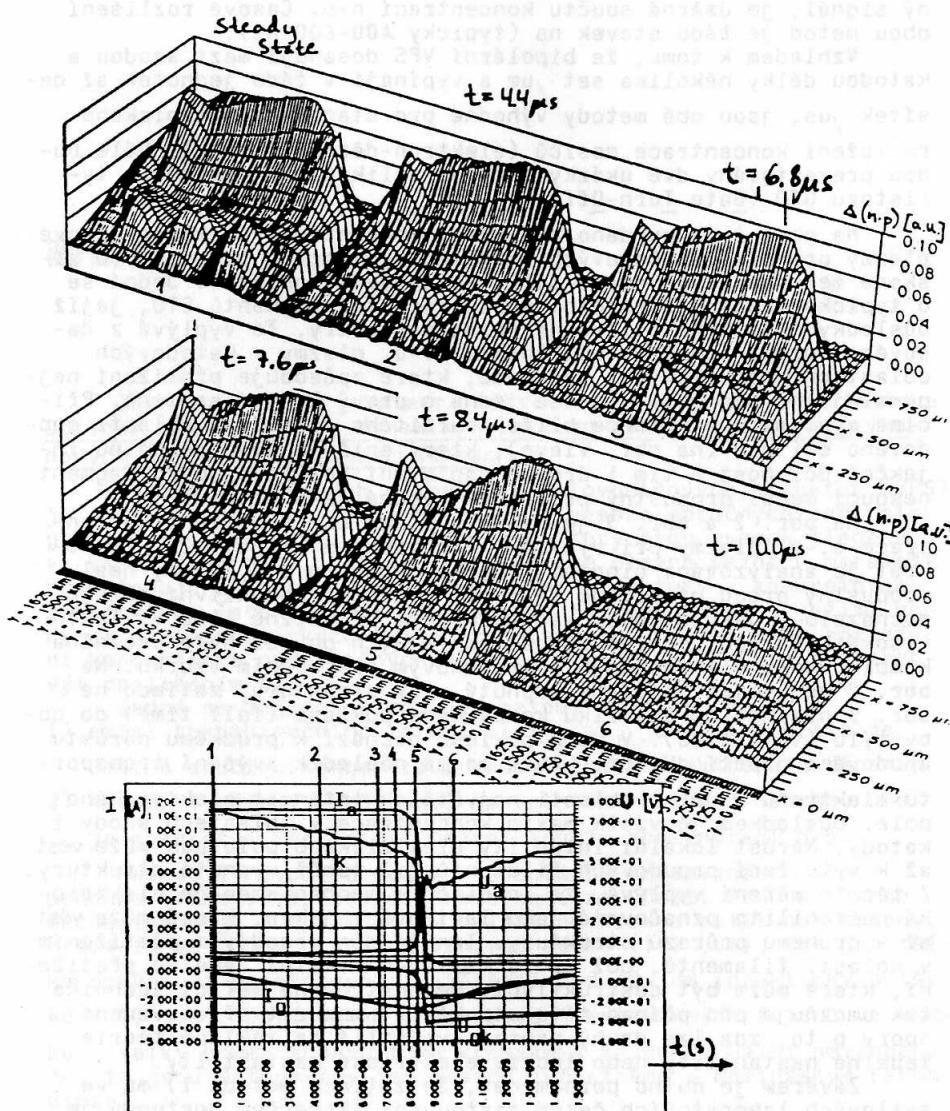
Vzhledem k tomu, že bipolární VPS dosahují mezi anodou a katodou délky několika set μm a vypínají v řádu jednotek až desítek μs , jsou obě metody výhodné pro stanovení dynamického rozložení koncentrace nosičů (elektron-děrové plazmy). Dále budou prezentovány dvě ukázky z mnoha aplikací na vypínacím tyristoru GTO (Gate Turn-Off).

Na obr. 1 je uvedeno rozložení koncentrace elektron-děrové plazmy pro několik časových okamžiků vypínacího procesu GTO získané metodou 1) ve směru šířky katodových kontaktů. Jedná se o typickou ukázku paralelní spolupráce tří segmentů GTO, jejíž důsledky negativně ovlivňují mezní parametry. To vyplývá z časového rozdílu procesu stlačování e.-d. plazmy v katodových oblastech jednotlivých segmentů, které způsobuje přetížení nejpomalejšího segmentu. Zde se jedná o pravý krajiní segment. Příčina vyplývá z existence blíže neurčitého defektu v oblasti anodového emitoru (na obr. vlevo), který snižuje jeho celkovou injekční účinnost a tím i úroveň zaplavení nosiči náboje. Segment nesoucí menší propustný proud pak vypíná jako první.

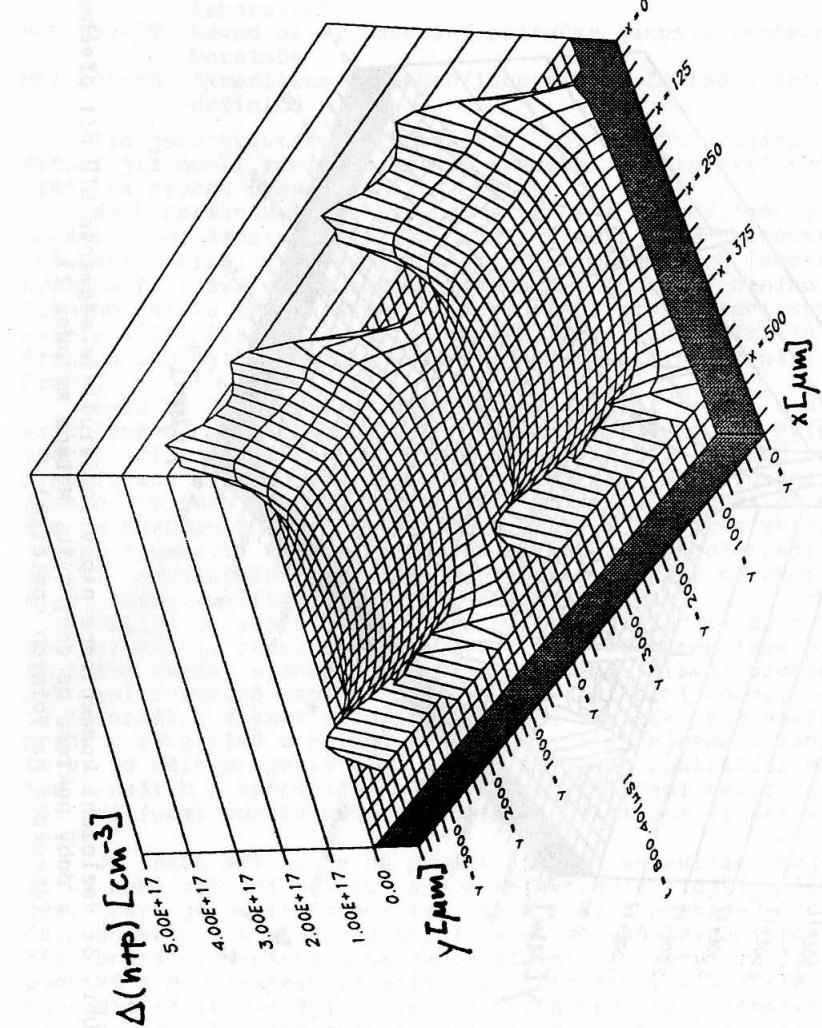
Na obr. 2 a obr. 3 je uvedeno dynamické rozložení koncentrace e.-d. plazmy při vypínání GTO získané metodou 2). Tentokrát je analyzována činnost jednoho segmentu GTO, který nesl propustný proud přibližně 4A a při vypínání induktivní zátěže docházelo k nárůstu blokovacího napětí přibližně 1100V . Takto vysoká blokovací schopnost bez ochranných obvodů byla umožněna kombinovaným elektronovým a protonovým ozařováním vzorku. Na obr. 2 je uveden ustálený sepnutý stav struktury, zatímco na obr. 3 přechod od okamžiku konce doby poklesu (fall time) do doby týlu (tail time). V době poklesu dochází k prudkému nárůstu anodového napětí dU_a/dt , které má za následek zvýšení transpor-

tu elektronů a děr v oblasti největších intenzit elektrického pole. Důsledkem je vznik maxim koncentrace v oblastech anody i katody. Nárůst lokální intenzity elektrického pole pak může vést až k vytvoření proudových filamentů již též vypnuté struktury. Z těchto měření vyplývá, že iniciačním mechanismem je elektrická nestabilita označovaná jako lavinová injekce, která může vést až k druhému průrazu struktury. Ten je dán proudovým přetížením v oblasti filamentů, což má za následek lokální tepelné přetížení, které může být destruktivní. Demonstrováná měřicí technika tak umožňuje pro případ této struktury rozsoudit dříve vedené spory o to, zda lze druhý průraz vysvětlit na základě teorie tepelné nestability nebo teorie elektrické nestability.

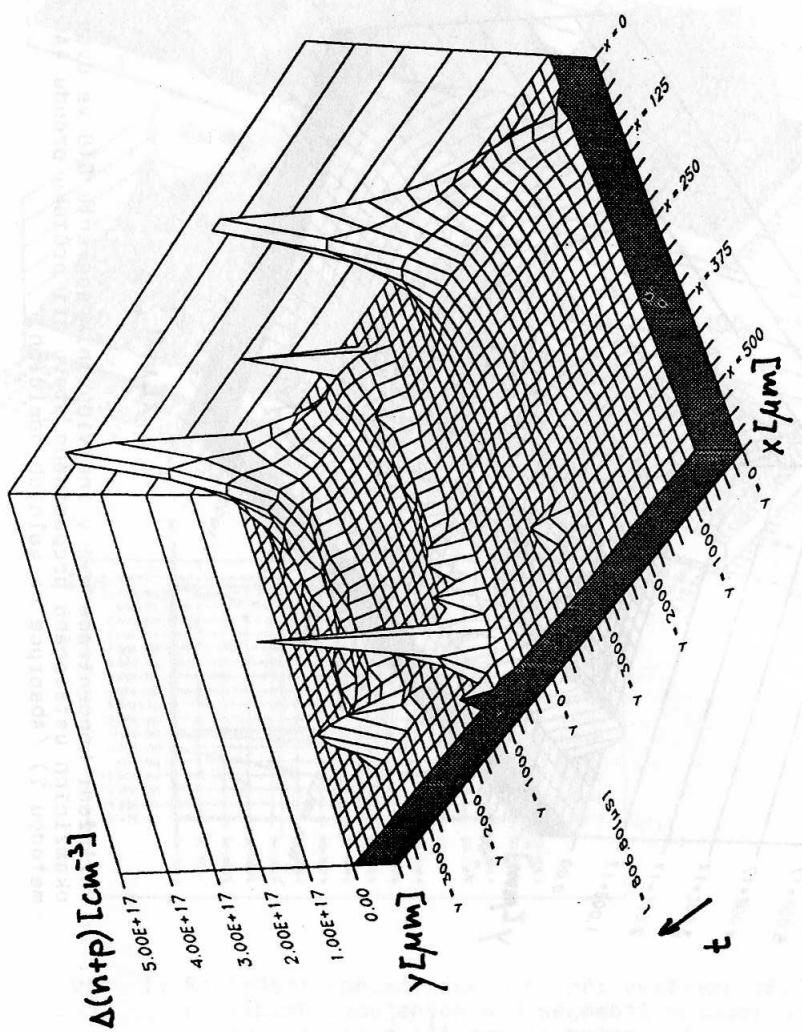
Závěrem je nutno poznamenat, že zatímco metoda 1) má ve světových laboratořích četné zastoupení (komerčně dostupný je např. "Hot electron analyzer" firmy Hamamatsu), metoda 2) je dnes dostupná na 2 - 3 pracovištích na světě.



Obr. 1: Rozložení koncentrace n+p při vypínání tří paralelně zapojených GTO segmentů nesoucích propustný proud 12A pomocí metody 1)



Obr. 2: Rozložení koncentrace n+p v individuálním segmentu GTO ve dvou časových okamžicích ustáleného propustného stavu při průtoku proudu 4A. Měřeno metodou 2) (Absorpce na volných nosících)



Akreditace laboratoří

Dr. Jan Mráz, CSc

V minulém Bulletinu (č. 60) jsme podali základní informaci o problematice akreditace laboratoří. Dnes můžeme připojit další, a to především tu, že Federální úřad pro normalizaci a měření vydal Metodické příručky pro akreditaci :

- MPA 001-90 Všeobecná kritéria pro výkon funkce akreditované zkušebny/laboratoře
- MPA 002-90 Základní principy postupu při prověřování zkušeben/laboratoří
- MPA 090-90 Návod na vypracování příručky jakosti zkušebny/laboratoře
- MPA 100-90 Akreditace zkušeben/laboratoří. Základní termíny a definice

Tím jsou vytvořeny předpoklady, aby všichni zájemci o akreditaci již mohli zcela konkrétně pracovat a připravit své pracoviště na proces prověřování.

Na Federálním úřadu pro normalizaci a měření jsou již evidováni první žadatelé o akreditaci a začala také pracovat prověřovací komise. V oblasti analytických chemických laboratoří byla např. prověřována pracoviště Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského v Praze, laboratoř emisní spektroskopie VŠCHT Praha, laboratoř chemie a zkoušení potravin VŠCHT Praha a laboratoř katedry kvasné chemie a bioinženýrství VŠCHT Praha.

Bylo by žádoucí, aby se celý akreditační proces dostal urychleně do větších obrátek, což ovšem vyžaduje, že příprava laboratoří k akreditaci bude mít výrazný předstih před prací prověřovací komise. Jakékoli vyčkávání nebo spekulování na získání výjimek z příslušných předpisů lze považovat přinejmenším za nezdodpovědný přístup, který může celý proces akreditace značně zpomalit. Nedobře připravené laboratoře odčerpají stejně již nedostatečnou kapacitu prověřovací komise na úkor těch, kteří budou kvalitně připraveni zbytečně čekat.

Určitě se vyplatí, jestliže si všichni žadatelé, a to i potencionální, znovu důkladně zváží, zda má akreditace pro ně skutečně takový význam, jaký předpokládají. Hlavní problém totiž není formálně naplnit požadavky akreditační normy, ale zcela neformálně získat autoritu a uznání výsledků své analytické práce u zákazníků a kolegů nejen doma, ale zejména v zahraničí. To by se mělo projevit mimo jiné i zvýšenou publikační aktivitou v našich i zahraničních časopisech. Příčemž nelze podceňovat ani formy populárního zpracování, přístupné široké veřejnosti.

Je třeba mít stále na paměti, že při akreditaci nejde o racionální nebo získání titulu, ale o daleko důležitější a širší proces, jakým je odstraňování tzv. technických překážek obchodu čs. podnikatelů a přizpůsobování se požadavkům evropských norm. Při konkrétních stycích se zahraničními partnery již řada našich podniků a podnikatelů narazila na tento problém a jistě se to bude dít stále častěji. V zemích Evropského společenství se rozvíjí trend smluvního prokazování úrovně zavedených systémů zabezpečování jakosti v rámci dodavatelsko-odběratelských vztahů a zajištění vzájemného uznávání těchto průkazů (certifikátů) v rámci připravovaného jednotného vnitřního trhu ES.

Za tím účelem přijala již v roce 1985 Rada Evropského spo-lečenství "Novou koncepci v oblasti harmonizace a normování". V souladu s ní vznikla v letošním roce "Evropská organizace pro testování a certifikaci" (EOTC) a jeden její specializovaný vý-bor "Evropský výbor pro posuzování a certifikaci systémů jakos-ti" (EQS), jehož úkolem je zabezpečení koordinace při jednotném uplatňování norem série EN 45 000. Dále pak vznikl i výkonný orgán "Evropská síť pro posuzování a certifikování systémů jakos-ti" (EQNET).

V Československu se začínají objevovat např. některé němec-ké firmy, které bud jsou členy výše uvedených vrcholných evrop-ských společností (takovou je např. firma DQS) nebo dosud ne (např. firmy TÜV), které nabízejí našim podnikům provedení cer-tifikace systémů jakosti, respektive i poradenské služby v této oblasti, pochopitelně za úhradu v tvrdé měně.

Pokud včas nezachytíme tento nástup, může se stát, že čs. organizace, které mají pro výkon takovýchto služeb plné předpo-klady nakonec budou z toho "vyšachovány". Na druhé straně je známé, že čs. podniky v převážné většině nejsou na certifikaci systémů zabezpečování jakosti dostatečně připraveny. Jde tedy o to, aby na potřebné úrovni byl systém zabezpečování jakosti zaveden do našich výrobních a obchodních organizací, což součas-ně vyžaduje vybudování sítě specializovaných organizací schop-ných posuzovat úroveň těchto systémů.

V tomto smyslu vyvolal UTRIN, s.p. Praha iniciativu k zalo-žení prvního čs.sdružení poradenských organizací pro oblast sy-stémů zabezpečování jakosti. Sdružení Analytika se stalo jeho členem a je připraveno všem zájemcům nejen poradit, ale i pomo-cí. Máte-li zájem můžete se se svými dotazy a požadavky obrátit na sekretariát sdružení Analytika (VŠCHT, Technická 5, 166 28 Praha 6, tel. 311 17 91).

XI. CANAS - Moskva 1990

V dňoch 29.júla až 4.augusta t.r. prebiehala v Moskve už jedenásta Konferencia o analytickej atómovej spektroskopii (CANAS). Séria týchto konferencií zameraných svojou tematikou na využitie atómovej spektroskopie najmä na prvkovú analýzu, za-počala pred viac než 30 rokmi v našej vlasti (Tatranská Lomnica - 1959) a postupne sa rovídala v medzinárodnom meradle až na dnešnú tradíciu organizovania týchto podujatí v dvojročnom in-tervale v párnich rokoch, čím sa prirodzene dopĺňa sled Medzinárodných spektroskopických kolokvií poriadanych vždy v rokoch nepárnych. Okrem toho je CANAS charakterizovaná i teritoriálnou väzbou na oblasť strednej a východnej Európy. Po doterajšom or-ganizovaní CANAS v stredoeuropských krajinách, v tomto roku bo-lo toto podujatie poprvé v ZSSR, čo v značnej miere posilnilo jeho dnes už výrazný medzinárodný charakter.

Na konferencii v Moskve sa zúčastnilo asi 460 spektrosko-pikov, z čoho vyše 100 bolo zo zahraničia reprezentovaného 20 štátmi. Z ČSFR sa na CANAS aktívne zúčastnilo 12 pracovníkov, ktorí svojimi príspevkami dôstojne reprezentovali nášu atómovú spektroskopiu.

Konferencia sa konala v kongresovom centre hotela Cosmos. Odborný program pozostával z plenárnych prednášok, vyžiadaných orálnych a prihlásených posterových príspevkov. Jedenášt' ple-nárnych prednášok bolo prezentovaných významnými svetovými od-borníkmi na tému hodnotiace stav a rozvoj v aktuálnych oblasti-ach atómovej spektroskopie, pričom treba okrem hodnotenia sú-časných možností optickej emisnej a atómovej absorpcnej, ako aj röntgenofluorescenčnej spektroskopie a to ako z hľadiska teoretičkeho, tak i analyticky aplikačného, osobitne spomenúť pro-blematiku prípravy vzoriek, vnášania vzoriek do atomizátorov, resp. budiacich zdrojov, a progresívne metódy, ako hmotnostnú spektrometriu s ICP zdrojom iónov, fluorescenčnú spektroskopiu a kombináciu separačných metód so spektrálnymi, umožňujúcim špe-ciáciu analyzovaných objektov. Vyžiadané početné orálne prís-pevky prebiehali v paralelných sekciách, kde v "klasických od-vetviach" prevládala čo do množstva, včítane posterov, optická emisná spektroskópia (142 príspevkov) nad atómovou absorpciou (118 príspevkov). Osobitne prekvapivým bol vysoký počet prís-pevkov v oblasti röntgenofluorescenčnej spektroskopie (105) a najmä z atómovej laserovej spektroskopie (46 príspevkov), čo poukazuje na súčasné trendy rozvoja týchto oblastí, najmä v ZSSR. Okrem toho bolo ešte 27 príspevkov venovaných špeciálnym problémom (porovnanie metód, čisté chemikálie a materiály apod.), zaradených do osobitnej skupiny nazvanej "rôzne".

Konferencia bola dobrou reprezentáciou prehľadu súčasného stavu a najnovších poznatkov dosiahnutých v atómovej spektro-skopii a to najmä v ZSSR. O niektorých z nich bolo dosiaľ to-ži pomerne zložité získať potrebné informácie a naviazalať osobný kontakt. Na druhej strane nevyužila, podľa môjho názoru, väčšina sovietskych účastníkov v plnej miere možnosti získania in-formácií prezentovaných zahraničnými kolegami, čo možno vysvet-líť z jednej strany snáď ich doterajšou menšou ostrieľanosťou v praktike priebehu veľkých medzinárodných podujatí a z druhej strany ich značnou jazykovou neprípravenosťou o tom sviedčí i ich pomerne malá účasť na prednáškach, ktoré boli takmer bez výnimky prednesené po anglicky. Naproti tomu bola značna účasť

a záujem na posteroch, kde sa poväčíne vystačí i so skromnejšími jazykovými znalosťami, resp. sa hovorilo po rusky. Osobitný záujem bol i o bohatú výstavu prezentujúcu najnovšiu prístrojovú techniku, kde jednotlivé firmy mali svojich rusky hovoriacich zástupcov.

Ako jeden z mála účastníkov, ktorí stáli pri zdroe týchto konferencií a ktorí sa (s výnimkou jednej) zúčastnili na všetkých CANAS, môžem plne potvrdiť ich stúpajúcu vedeckú úroveň. Sovietski organizátori zabezpečili i napriek súčasnej, nie jednoduchej situácii v ich krajinе, svojim plným osobným nasadením mimoriadne zdarný priebeh tohto podujatia a to nielen po vedeckej, ale i po organizačnej a spoločenskej stránke, za čo im i touto cestou patrí naše podakovanie. Taktiež zasadanie reprezentantov jednotlivých krajín poriadajúcich CANAS, ktorého som sa zúčastnil ako predstaviteľ CSSS jednoznačne zhodnotilo pozitívny prínos Moskovskej konferencie pre rozvoj a prehľbenie nie len poznatkov, ale i rovnocenne dôležitých osobných kontaktov. Na základe toho sa rozhodlo, že i za podmienok novej situácie v Europe sa bude pokračovať v organizovaní týchto podujatí. Bolo prijaté pozvanie maďarských kolegov organizovať v r. 1992 ďalšiu CANAS. Neostáva mi preto už nič viac, než zaželať :

Dovedenia v Maďarsku !

Prof.E.Plško, DrSc

20 let komerčních zařízení pro AAS s elektrotermickou atomizací v grafitových kyvetách

Dr.Z.Slovák, CSC

U příležitosti dvacetiletého jubilea uvedení prvních komerčních zařízení pro elektrotermickou atomizaci HGA-70 na trh uspořádala firma Bodenseewerk Perkin-Elmer "Evropské symposium - 20 let HGA-technologie firmy Perkin-Elmer". Tato prestižní akce se konala pro 200 zvaných hostů z mnoha zemí 2. a 3. října 1990 jednak v sídle firmy v Überlingen na Bodamském jezeře (exkurze do výrobního provozu, firemního muzea, přijetí u starosty města), jednak v "Novém zámku", barokním biskupském paláci, v blízkém městečku Meersburg. Mimořádný lesk dodala symposiu účast zakladatele AAS s elektrotermickou atomizací B.V.Lvova z Leningradu a dalších vědců osobností, které se v daném oboru angažovaly, jako např. W.Frecha, L.deGalana, W.Slavina, B.Welze.

Prosloveno bylo 7 přednášek, které se krom jediné, retrospektivní, oceňující m.j. pionýrské dílo zesnulého H.Massmanna, zabývaly současnými problémy metody (B.Lvov - mechanismy atomizace, B.Slavin - moderní aplikační možnosti, pevné vzorky, STPF, B.Welz - FIA, prekoncentrační postupy, W.Frech - atomizátory s konstantní teplotou, M.T.C. deLoos-Vollebregt - zeemanovská korekce pozadí, G.Schlemmer - korekce pozadí v analytické praxi). Účastníkům byl předveden nový komerční atomový absorpcní spektrometr s elektrotermickou atomizací "Zeeman 4100 ZL" s konstrukčně zcela nově řešenou grafitovou kyvetou s příčným ohřevem (konstantní teplota v celém profilu) a integrovanou Lvovou platformou a unikátní kompenzací neselektivní absorpcie v podélném magnetickém poli. Toto řešení odstraňuje užití polarizovaného světla v optickém systému a vede k významnému zlepšení kvality měření.

K celkovému úspěchu symposia kromě elitní vědecké úrovni přispěl i společenský program, dokonalé organizační zabezpečení a v neposlední řadě i krásné slunečné počasí.

GLOSSARY OF ABBREVIATIONS AND ACRONYMS

AA	atomic absorption
AAS	atomic absorption spectroscopy/metry
ACS	American Chemical Society
A/D	analog-to-digital
ADC	A/D converter
AES	atomic emission spectroscopy/metry
AES	Auger electron spectroscopy
AFNOR	French Association for Standardization (Association Francaise de Normalisation)
AFS	atomic fluorescence spectroscopy
AMG	German Medicines Act (Arzneimittelgesetz)
AOX	adsorbable organic halogen
APS	appearance potential spectroscopy
ARIES	angular resolved ion and electron spectroscopy
ASIA	atomizer, source, ICPs in AFS
ASTM	American Society for Testing and Materials
ATRS	attenuated total reflection spectroscopy (also known as IRS)
BET	surface determination according to Brunauer, Emmet and Teller
BG	battery grade
BOD	German chemical trades association (Berufsge- nossenschaft Chemische Industrie)
BS	biological oxygen demand
CADI	British Standard
CARN	computer assisted dispersive infrared
CARS	Chemical Abstracts registry number
CAS	coherent anti-Stokes Raman spectroscopy
CASSI	Chemical Abstracts Service
CD	Chemical Abstracts Service Source Index
CEIR	circular dichroism
CFA	cryogenically enhanced infrared
CID	continuous flow analysis
CI/MS	collision-induced dissociation
C.I.No	chemical ionization mass spectrometry
CIR	colour index number
COD	cylindrical internal reflectance (an FT-IR sampling technique)
COMAS	chemical oxygen demand
COSY	concentration-modulated absorption spectroscopy
CP-MAS	homonuclear correlation spectroscopy
CRAMPS	cross-polarization magic angle sample spinning (numerous variations)
	combined rotation and multiple pulse spectroscopy

CSAA	continuum-source atomic absorption (spectroscopy)
CSN	conductive solids nebulizer
CSRS	coherent Stokes Raman spectroscopy
CVLS	copper-vapor lasers
CW	continuous wave (opposite of pulsed in laser terminology)
D/A	digital-to-analog
DAC	diamond anvil cell
DCP	direct current plasma
DEV	German standard methods for the analysis of water, waste water and sludge (Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, Abwasser- und Schlamm-Untersuchung)
DFG	German research association (Deutsche Forschungsgemeinschaft)
DIN	direct injection nebulization
DIN	Deutsche Industriennorm
DIN	Deutsches Institut für Normung
DL	detection limit (see also LOD)
DLTS	deep-level transient spectroscopy
DMS	dynamic mass spectrometer
DR	diffuse reflectance
DRS	depolarized Rayleigh spectrum
DRIFTS	diffuse reflectance infrared Fourier transform spectroscopy
DSC	differential scanning calorimetry
DTA	differential thermal analysis
DTGS	deuterated triglycine sulfate (detector)
EC	Enzyme Commission
EC	electron capture
ECD	electron capture detection (detector)
EDS	energy dispersive spectroscopy
EDXRF	energy-dispersive x-ray fluorescence spectrometry
EELS	electron energy-loss spectroscopy
EGP	evolved gas profile
EI/MS	electron impact/ionization mass spectrometry
EMPA	electron microprobe analysis (see EPMA)
ENDOR	electron nuclear double beam resonance
EOCl	extractable organic chlorine
EPA	Environmental Protection Agency (see also US EPA CLP)
EPMA	electron probe microanalysis (see EMPA)
EPR	electron paramagnetic resonance spectroscopy
ESCA	electron spectroscopy for chemical analysis (see also XPS)
ESR	electron spin resonance spectroscopy

ETA	electrothermal atomization
ETAAS	electrothermal atomic absorption spectroscopy
ETV	electrothermal vaporization
EXAFS	extended x-ray absorption, fine structure
FAAS	flame atomic absorption spectroscopy
FAB/MS	fast atom bombardment mass spectrometry
FAES	flame atomic emission spectroscopy
FAFS	flame atomic fluorescence spectroscopy
FAM	German mineral oil and fuel standards commission (Fachausschuss für Mineralöl- und Brennstoff-Normung)
FAS	flame absorption spectroscopy
FDCCD	fluorescence detected circular dichroism
FDMS	field desorption mass spectrometry
FFS	flame fluorescence spectroscopy
FFT	fast Fourier transform
FIA	flow injection analysis
FID	fluorescence indicator analysis
FIMS	free-induction decay
FID	flame ionization detector
FIP	field ionization mass spectrometry
FIRE	International Pharmaceutical Federation (Fédération Internationale Pharmaceutique)
FO	flame infrared emission spectroscopy
FPT	fibre optics
FREDOF	fundamental parameters technique
FT	frequency-domain fluorometry
FT-IR	Fourier transform-infrared spectroscopy
FWHH	full peak width at half height
FWHM	full width at half maximum
GC	gas chromatography
GDMS	glow discharge mass spectrometer(ry)
GFAAS	graphite furnace atomic absorption spectroscopy
GMP	good manufacturing practice
GPC	gel permeation chromatography
GPMA	gas phase molecular absorption spectroscopy
GR	guaranteed reagent
HDPE	high density polyethylene
HETEROCOR	two-dimensional heteronuclear correlation spectroscopy
HG	hydride generation
HGA	heated graphite atomization
HIC	hydrophobic interaction chromatography
HPLC	high performance liquid chromatography
HPTLC	high performance thin layer chromatography
HQI	hit quality index
HREELS	high resolution electron energy loss spectrometers

HTS	Hadamard transform spectroscopy
IC	ion chromatography
ICAP	inductively coupled argon plasma
ICP	inductively coupled plasma spectrometry
ICR	ion cyclotron resonance (also FT-MS)
IDL	instrument detection limit
IDMS	isotope dilution mass spectrometry
IETS	inelastic electron tunneling spectroscopy
INADEQUATE	incredible natural abundance double quantum transfer experiment
INEPT	insensitive nuclei enhanced by polarization transfer
I/O	input-output
IR	infrared
IRS	internal reflection spectroscopy (see also ATRS)
ISCA	ionization spectroscopy for chemical analysis
ISO	International Organization for Standardization
ISS	ion scattering spectroscopy
ITD	ion trap detector
ITMS	ion trap mass spectrometry
IUPAC	International Union of Pure and Applied Chemistry
IVR	intramolecular vibrational-energy redistribution
JCAMP.DX	Joint Committee on Atomic and Molecular Physical Data (file structure)
LALS	low-angle laser scattering
LAN	local area network
LAMMA	laser-microprobe mass analysis
LBK	lecture bottle - corrosive gas
LBN	lecture bottle - non-corrosive gas
LC	liquid chromatography
LD	laser desorption
LEAFS	laser-excited atomic fluorescence spectrometry
LEI	laser-enhanced ionization
LIF	laser-induced fluorescence
LIMA	laser ionization mass analysis
LIMS	laboratory information management system
LLC	liquid-liquid chromatography
LLPC	liquid-liquid partition chromatography
LOD	limit of detection (see also DL)
LP-CI	low pressure chemical ionization
LSAAS	line-source atomic absorption spectroscopy
LSC	liquid-solid chromatography
LSIMS	liquid secondary ion mass spectrometry
MAC	maximum allowed concentration
MAGIC	monodisperse aerosol generation interface combining LC and MS

MAK	maximum workplace concentration (maximale Arbeitsplatzkonzentration)
MAS	magic angle spinning
MASS	magic angle spinning sample
MBE	molecular beam epitaxy
MCA	multichannel analyzer
MCD	magnetic circular dichroism
MCP	microchannel plate
MCT	mercury cadmium telluride (detector)
MEFSD	maximum entropy Fourier spectral deconvolution
MEM	maximum entropy method
MI	matrix isolation
MIKE	mass selection followed by ion kinetic energy analysis
MIP	microwave-induced plasma
MIRS	multiple internal reflection spectroscopy
MLR	multiple linear regression
MOS	metal oxide semiconductor
MPI	multiphoton ionization
MRI	magnetic resonance imaging
MS	mass spectrometry
MTES	metastable transfer emission spectroscopy
N3/N4	metals with 3 or 4 nines in the purity figure (i.e. 99.9% resp. 99.99%)
NAA	neutron activation analysis
NBS	see NIST
near-IR	near-infrared spectroscopy (NIR)
NDIR	nondispersive infrared analysis
NIR	near-infrared spectroscopy (see also near-IR)
NIRS	near-infrared (reflectance) spectroscopy
NIST	National Institute of Standards and Technology, formerly National Bureau of Standards
NNR	new and nonofficial remedies
NOESY	(two-dimensional) nuclear Overhauser effect spectroscopy
NQR	nuclear quadrupole resonance
NMR	nuclear magnetic resonance
OAS	opto-acoustic spectroscopy
OES	optical emission spectroscopy
OMA	optical multichannel analyzers
ORD	optical rotatory dispersion
OSMA	optical spectrometric multichannel analyzer
PA	polyamide
PAA	proton activation analysis
PAH	polycyclic aromatic hydrocarbons
PAK	polycyclic aromatic hydrocarbons (polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe)
PAS	photo-acoustic spectroscopy

PASCA	positron annihilation spectroscopy
PCB	polychlorinated biphenyls
PCR	principal component(s) regression
PDA	photodiode array (adapter)
PDMS	plasma desorption mass spectrometry
PDS	pulse-height distribution analysis
PES	photoelectron spectroscopy
PGSE	pulsed-gradient spin-echo (NMR technique)
PIGE	particle (proton) induced gamma-ray emission spectroscopy
PIXE	particle (proton) induced x-ray emission spectroscopy
PL	photoluminescence
PLC	preparative layer chromatography
PLS	partial least squares
PND	phosphorus nitrogen detector
PMA	photonic multichannel analyzer
PMT	photomultiplier tube
PPS	photophoretic spectroscopy
PVDF	polyvinylidene difluoride
PTFE	polytetrafluoroethylene
QCP	quality control protocol(s)
RBS	Rutherford backscattering spectrometry
REMPI	resonance enhanced multiphoton ionization
rf	radio frequency
RFA	Röntgen-Fluoreszenz-Analyse (x-ray fluorescence analysis)
RFS	remote fiber spectroscopy
RGA	residual gas analyzer(sis)
RI	refractive index
RIA	radioimmunoassay
RIMS	resonance ionization mass spectrometry
rms	root mean square
ROA	Raman optical activity
RP	reversed-phase chromatography
RR	resonance Raman (effect)
RTECS	registry of toxic effects of chemical substances
SAM	scanning Auger microprobe(scope)
SBD	Schottky barrier diode
SBR	signal-to-background ratio
SD	standard deviation
SECSY	spin-echo correlated spectroscopy
SEM	scanning electron microscope/microscopy
SERS	surface-enhanced Raman spectroscopy
SFC	supercritical fluid chromatography
S-H	Smith-Hieftje (background correction)

SHG	second harmonic generation
SIM	scanning ion microscopy
SIM	selective ion monitoring
SIMS	secondary ion mass spectrometry
SLWD	super-long working distance (microscope lenses)
SMEAR	Sunbury multielement analytical routine
SMR	sectional magnetic resonance
S/N	signal-to-noise ratio
S.No.	Schultz colour table number
SPC	statistical process control
SPU	sample preparation unit
SRM	standard reference material
SSMS	spark-source mass spectrography
STEM	scanning transmission electron microscope/microscopy
STM	scanning tunneling microscope
SWIFT	stored waveform inverse Fourier transform (excitation)
TCD	thermal conductivity detector
TDMS	tandem quadrupole mass spectrometry
TGA	thermogravimetric analysis
TGS	triglycine sulfate (detector)
TIMS	thermal ionization mass spectrometry
TISAB	total ionic strength adjustment buffer
TLC	thin-layer chromatography
TOC	total organic carbon
TOF SIMS	time-of-flight secondary ion mass spectrometry
UHV	ultrahigh vacuum
UPS	ultraviolet photoelectron spectroscopy
US EPA CLP	United States Environmental Protection Agency's Contract Laboratory Program
UV	ultraviolet
UV/VIS	ultraviolet-visible spectroscopy
VASS	variable angle sample spinning
VCD	vibrational circular dichroism
VT-CPMAS	variable temperature-cross polarization
	magic angle spinning
VUV	vacuum ultraviolet
WDS	wavelength dispersive spectroscopy
WDXRF	wavelength dispersive x-ray fluorescence
WGK	Wassergefährdungsklasse (German water pollution risk classes)
XPS	x-ray photoelectron spectroscopy (also ESCA)
XRD	x-ray diffraction
XRF	x-ray fluorescence spectrometry
XRMF	x-ray microfluorescence spectroscopy
ZAA	Zeeman atomic absorption

INFORMACE

- informace - přihlášky - typ žádat
- novinky
- zprávy o novinkách
- aktuality

8th International Conference on Fourier Transform Spectroscopy

Lübeck-Travemünde, 1. - 6.9.1991

informace - přihlášky : Gesellschaft Deutscher Chemiker
Abt. Tagungen
P.O.B. 90 04 40
D-6000 FRANKFURT 90
BRD

TEXTY NORMATIVNÍCH DOKUMENTŮ

Evropské normy řady EN 45 000
normy ISO řady 9000
směrnice pro používání normy ÖNORM A 6672
nabízí na disketách 5 1/4" (360 kB) PC XT/AT IBM zpracovaných
editorem T602
UTRIN, odbor 700, U Sovových mlýnů 9, Praha 1
(informace Ing.Janda (02)534021).

ZASTOUPENÍ FIREM

RAITH GmbH/SRN (příslušenství pro rastrovací elektronové mikroskopky - Tesla i z dovozu)
GETAC INSTRUMENTEBAU GmbH/SRN (zařízení americké firmy KEVEX Corp. pro energ.-dispersivní rentgenovou mikroanalýzu, rentgenovou fluorescenční analýzu, analýzu tenkých vrstev na silných substrátech a rychlou analýzu a třídění kovů)

má pro ČSFR Ing.Pavel Pour
Za divadlem 2
602 00 Brno tel. 22749, fax 747249

OBNOVU KAZETOVÝCH PÁSEK

do tiskáren výpočetní techniky provádí

IVAR MENTZL

Charkovská 16

101 00 Praha 10

tel. (02) 732177 (večer)

ALTEC spol. s r.o., analytická laboratorní technika
Praha 9. Khodlova 1297
PSČ 193 00

nabízí okamžitě k dodání

- křemenné trubice TMA 254 s náplní i bez
- katalyzátor
- niklové lodičky - typ VŠCHT
- amalgamátory
- korundové nosníky lodičky
- niklové nosníky lodičky

SERVIS TMA 254

SERVIS TMA 254

SERVIS TMA 254



analytická laboratorní technika

PRAHA - 9, Khodlova 1297, PSČ 193 00

Špička laboratorní techniky

AMA 254

nový model analyzátoru rtuti
vysoká citlivost
široký rozsah koncentrací
vícebodová kalibrace
statistické zpracování výsledků
možnost přímého dávkování pevných vzorků

cena: 140 000 Kčs - včetně software, bez PC

NEVÁHEJTE NEVÁHEJTE NEVÁHEJTE NEVÁHEJTE

Československá spektroskopická společnost

časopis pro spektroskopii a kvantovou chemii

číslo 1/1990

červenec 1990

českobudějovické vydání kód 000 000 000 000
do číslo 389 1990 vydalo ČSVA
číslo 1/1990

články a komunikace

od k hledání a řízení výzkumu -
poznaminky -
TEORIE akty - výzkumy využití -
výroba - vývoj -
výzkumy využití -
výzkumy využití -

články o výzkumu

články o výzkumu

články o výzkumu



číslo 389 , ČSVA vydání , číslo 1/1990

českobudějovické vydání

články o výzkumu

Československá spektroskopická společnost při ČSVA
adresa sekretariátu : 160 00 Praha 6, Kozlovská 1

Redakce : Dr. Milan Fara, CSc

Techn. redakce : P. Vampolová. Redakční uzávěrka prosinec 1990

Pouze pro vnitřní potřebu